

USPTO、初代特許品質担当副局長に Valencia Martin Wallace 氏を任命

2015年2月4日
JETRO NY 知財部
今村、丸岡

USPTO の Michelle Lee 副長官は、Valencia Martin Wallace 氏を初代特許品質担当副局長(Deputy Commissioner for Patent Quality)に任命した。

これまで、品質管理は、Office of Patent Examination Policy(Drew Hirshfeld 副局長)の中にある OPQA(Office of Patent Quality Assurance)が担当していたが、当人事により今後は品質管理部門が分離し副局長級部署に昇格する。

Lee副長官の発表によれば、今後、昇格した品質管理部門は、Wallace 新副局長のもとで特許の品質向上に向けた新たなプログラムの実施を発表する予定であり、その中ではビッグデータの活用などを検討しているとのこと。詳細は近日官報にて公表される予定。

Wallace 氏は、Howard 大学の理工学部とジョージワシントン大学のロースクールを卒業した後、USPTO に特許審査官として入庁し、その後、人事担当や研修担当、審査長などを経て、2011年より Patent Operations 担当の管理職に就いていた。

現在、USPTO では副長官、特許局長、商標局長、Wallace 品質担当副局長等々、多くの女性管理職が活躍している。

新副局長就任に関するプレスリリース:

http://www.uspto.gov/patents/init_events/Deputy_Commissioner_for_Patent_Quality.jsp